

基于激光诱导击穿光谱 (LIBS) 的表面分析技术

Surface Analysis Techniques Based on Laser Induced Breakdown Spectroscopy



日录 CONTENTS

- 1/ 系统简介
- 2/ 关键技术
- 3/应用现状
 - 4/ 发展趋势



- 》 激光诱导击穿光谱(LIBS,Laser Induced Breakdown Spectroscopy)技术,是基于对物质等离子体的发射光谱的探测,来分析物质成分的方法:
 - 利用高能短脉冲激光聚焦到被测样品上,激发样品产生高温等离子体
 - 样品物质的电子跃迁至高能态,返回初始能态时发出特定光谱辐射
 - 利用光谱仪对该光谱进行分析研究,可得到被测物质的成分与浓度

LIBS技术的优点:

- 1. 快速直接分析, 样品制备简单
- 2. 可以检测几乎所有元素
- 3. 可以同时分析多种元素
- 4. 被测物形态多样性: 固态、液态、气态
- 5. 仪器便携,易拓展到实验室外
- 6. 支持原位检测

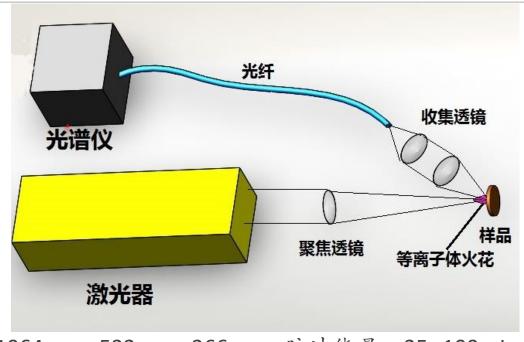


系统简介

关键技术 应用现状 发展趋势

LIBS系统的组成

- > 激发光源
- > 收集光路
- > 光谱仪
- > 数据采集处理



组成:

激发光源:调QYAG固体激光器,波长1064nm、532nm、266nm;脉冲能量:25~100mJ;

脉冲宽度:~10ns;聚焦光斑直径:~0.1mm

收集光路: 通过透镜或透镜组合, 耦合进光纤, 大数值孔径, 高收集效率

光谱仪: 紫外可见光波段, 高分辨率, 采集时间延时可调

数据处理: 时序控制、数据预处理、算法模型、界面显示



G: 系统参数; h:普朗克常量; k:玻尔兹曼常数; v_{ul} : 跃迁频率;

在实验条件一定时,测量光谱强度 与样品元素含量之间存在确定关系



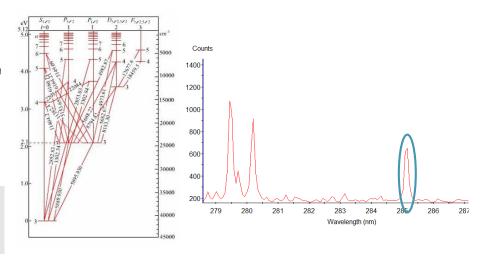
 $I_{ul} \propto N_0$

元素定性分析:

元素跃迁对应波长确定的特征谱线

$$E_u - E_l = h \frac{c}{\lambda_{ul}}$$

光谱中特征谱线存在 → 样品中存在对应元素



■ 元素定量检测

$$I_{ul} = \frac{4\pi Gh \nu_{ul} g_u A_{ul} N_0}{Z(T)} \exp\left(-\frac{E_u}{kT}\right)$$

不同激发间的配分函数Z不同、温度T不同

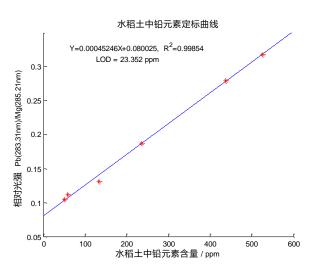
内标法

待测元素A,参考元素B, $E_A \approx E_B$

$$I_R = \frac{I_A}{I_B} = \frac{N_A}{N_B} \frac{\nu_A \frac{g_A A_A}{Z_A}}{\nu_B \frac{g_B A_B}{Z_B}} e^{-\frac{(E_A - E_B)}{kT}}$$

$$I_R = a \frac{C_A}{C_B}$$

相对光强 I_R 与待测元素含量C存在线性关系 \rightarrow 定标曲线



水稻土中Pb元素定标曲线



系统主要组成部分

一、激发模块

- 利用激光使被测样品的局部电离,产生等离子体
- 高能激光脉冲瞬时功率密度可达10MW/cm²
 - 1.少量原子产生多光子电离,产生初始自由电子
 - 2.激光加速电子, 雪崩电离产生等离子体
- 另一种说法,激光烧蚀样品表面,产生的瞬间高温,使样品表面小部分物质瞬间气化,并进一步电离形成等离子体

影响因素

- 激光脉冲的脉冲总能量、功率密度、聚焦面积、脉冲时间
- 样品材料性质、表面形态、样品环境气压

典型激光器

- YAG 调Q固体激光器,
- 半导体泵浦的固体激光器
- 双脉冲激光



二、收集模块

硬件的系统性能优化一提高检测灵敏度 元素含量越低,谱线越弱,所以,提高信背比是提高检测灵敏度的主要 途径,等离子体温度为根本因素;关注元素谱线强度和背景连续谱强度 影响等离子体温度因素:

- 控制采集延时一背景连续谱下降快,特征谱线下降慢,所以存在最佳延时
- 调节激光脉冲能量一存在最优的激光脉冲能量,使信背比最大
- 收集光路对准等离子体火花最佳位置-噪声较低且谱线强度稳定
- 样品基底、环境气体等



三、样品台(室)

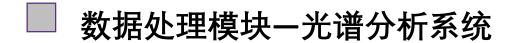
样品置于可三维精密调节的平移台。

样品室按需配置成充惰性气体、真空,或者增加磁场等。

样品形态一般可以是固态、液态、气态。

- 固态样品切割成合适大小,表面平整
- 粉末状样品压成片状
- 液态和气态置于合适容器中





分析 对象 内标法 求相对 光强

光谱数 据筛选 去除背 景噪声 拟合提 高精度 元素种 类识别

元素含 量分析

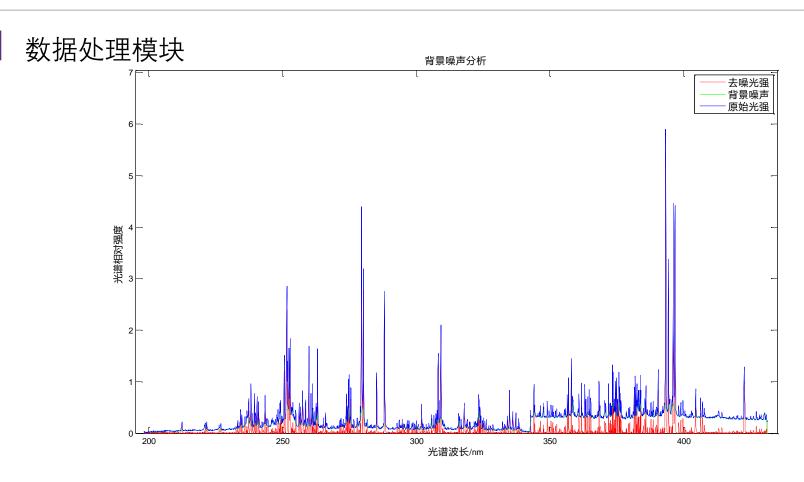
样品 分类 分析 结果

光谱预处理

系统简介

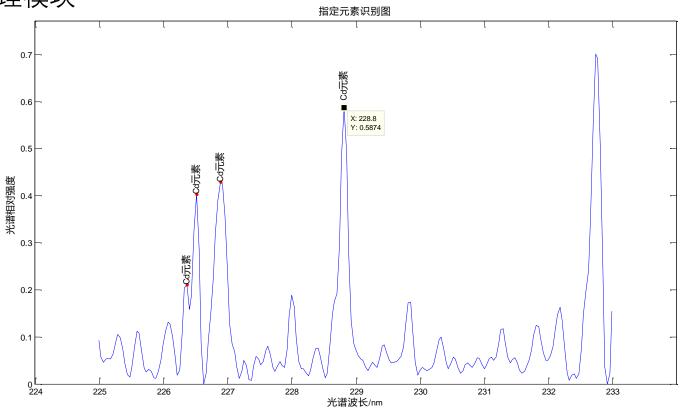
关键技术

应用现状 发展趋势



去除噪声和连续谱基底

数据处理模块



元素识别



工业领域:

- 冶金行业
- 矿石开采
- 石化行业
- 核电行业
- 新材料成分研究

反恐安全:

- 美国陆军研究实验室
- 开发LIBS设备进行爆 炸物鉴定与种类分析
- 大型设备可是检测距 离扩大到100m

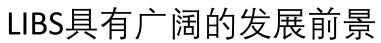
■ 农业-环境领域:

- 土壤中重金属元素含量检测
- 农田中氮磷钾含量检测
- 作物农药残留检测
- 水污染检测

▲ 其他领域:

- 考古及文物鉴定
- 生物医学
- 食品药品
- 宇宙空间探索





• 科研领域广泛







• 市场价值巨大





LIBS相关 应用领域	文献占比 2010-2015
工业生产	49%
生物医药	11%
环境地理	19%
纳米材料	4%
考古文物	4%
法医鉴定	7%
特种环境	6%

- LIBS具有迫切的应用需求
 - 实时在线、远程非接触、极限环境检测,LIBS具有不可替代性
 - 亟需快速检测大量样品的应用场景, LIBS具有天然的优势



目前已有几款LIBS产品:













矿物岩石的研究中,传统的地学分析仪器对于贫矿石元素检测较为困难:例如光学显微镜、电子探针、电子扫描显微镜、LIF或XRF技术等。对其中的U元素进行分析,困难在于:

- 元素分布很不均匀,有价值的信息经常隐藏于样品某一小区域内;
- 矿石中的U、Zr、Ti、Nb呈不规律的伴生或者隔离分布,难以检测到有效信息,但是其伴生分布信息对于矿业科学来说非常关键;
- 颗粒体积 (µm) 小;
- 一些金属相为胶态。

LIBS元素分析技术,是当前克服上述困难最为有效的技术。可以对元素的样品表面空间分布做Mapping---都是传统方法无法比拟的优势。

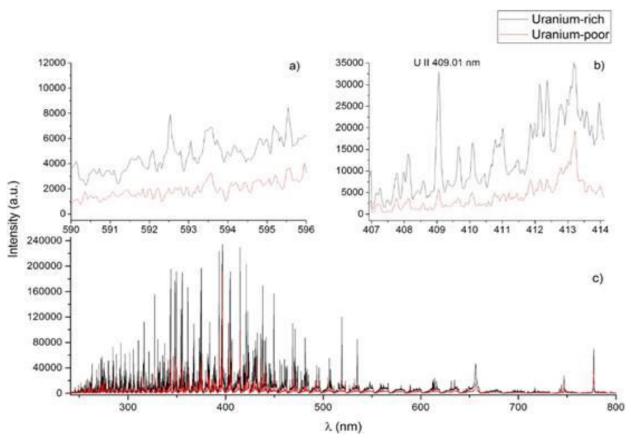
双激发LIBS元素分析技术:两次激光脉冲激发,采用低能量的532 nm 二倍频激光烧蚀并剥离出微量样品,然后采用较高能量的延时1064 nm激光 对剥离出的样品进行二次激发



铀矿检测的常规办法及其检测能力一览

分析方法	非接触测量	元素扫描 mapping
ICP-MS	否	否
ICP-AES	否	否
XRFX射线荧光光谱分析	否	可
Raman 光谱分析	可	可
LIF激光诱导荧光	可	可
Gamma 射线光谱分析	可	否
LIBS激光诱导击穿光谱	可	可

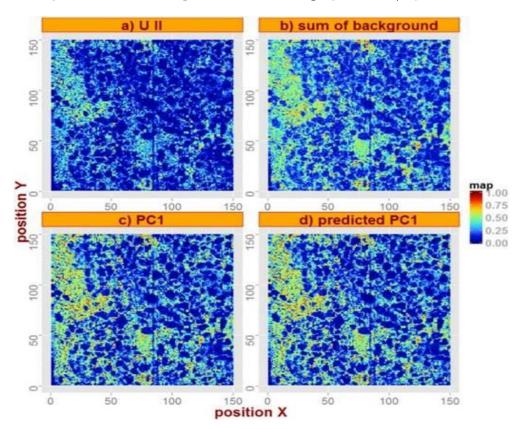




a) 背景(590-595 nm)谱线对比; b)含铀离子特征谱线 (409.01 nm)的波段光谱对比; c) 全波段谱线对比



获得Mapping分析结果:



- a) U II@409.01nm特征谱线强度分布; b) 590-595nm 背景区域谱线强度分布,
- c) PC1优化算法U II@409.01nm数值分布; d) PC1优化算法590-595nm 背景区域数值分布

